H – Personální zabezpečení - přednášející

Název VŠ / součásti	Technická univerzita v Liberci				ITE FMMIS TUL		
Název SP	Informační technologie						
Jméno a příjmení	**Ondřej Novák**				**Tituly**	Prof., Ing., CSc.	
Rok narození	1955	**typ vzt.**	vedlejší	**rozsah**	50 %	**do kdy**	12/2008
Další současní zaměstnavatelé				**typ prac. vztahu**		**rozsah**	
ČVUT Praha, FEL Praha 2, Karlovo náměstí 13				hlavní			

Přednášky v předmětech

Číslicová technika (100 %)
Programovatelné obvody (100 %)

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. Studia v doktorském SP

ČVUT FEL Praha, technická kybernetika, 1980
1978 - 80 Zastupující vedoucí Matematického odd. Ústavu výpočtové techniky ČVUT (20 pracovníků)
1980 - 1989 výzkumný pracovník V7zkumného ústavu matematických strojů, Praha
1989 - 2005 učitel, docent, profesor TU v Liberci
2005 - doposud profesor FEL ČVUT Praha

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

NOVÁK O., PLÍVA Z, JENÍČEK J., MADER Z., JARKOVSKÝ M:.Self Testing SoC with Reduced Memory Requirements and Minimized Hardware Overhead In The 21st IEEE International Symposium on Defect and Fault-Tolerance in VLSI Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006, vol. 1, s. 300-308. ISBN 0-7695-2706-X.

Novák, O, Gramatová, E., Ubar, R.: Handbook of Electronic Testing. Vydavatelství ČVUT, srpen 2005, 425 stran.

Novak, O., Zahradka, J., Pliva, Z.: COMPAS – Compressed Test Pattern Sequencer for Scan Based Circuits. Springer: Lecture Notes in Computer Science 3463, ISSN 0302-9743, 2005, pp. 403-414.

Novak O., Pliva Z., Nosek J., Hlawiczka A., Garbolino T., Gucwa K., : Test-Per-Clock Logic BIST with Semi-Deterministic Test Patterns and Zero-Aliasing Compactor, Kluwer Academic Publishers - Journal of ElectronicTesting: Theory and Applications 20, ISSN 0923-8174, pp.109-122, 2004.

Novák, O., Doležal, I.: Microprocessor-Based Controllers and Microelectronics.In Bishop R. H. (ed.) : The Mechatronics Handbook. Boca Raton : CRC Press, 2002, s. 4.1-7 ISBN 0-8493-0066-5.

Novák, O.: Comparison of test pattern decompression techniques. Proc. Design Automation and Test in Europe conference DATE03, Munich, March 3-7, 2003. pp. 1182-1183, ISBN 0-7695-1870-2, ISSN 1530-1591.

Působení v zahraničí

9/1987- 10/1987 Francie IMAG Grenoble stáž
7/1992 - 12/1992 Itálie, Genova Ricerche spolupráce v rámci Hezagonály
8/1998 – 9/1998 SRN, TU Stuttgart řešení společného výzkumu

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti	Technická kybernetika		**řízení na VŠ**	
			TU v Liberci	
			ohlasy publikací	
Rok udělení (prof…)	2002		**mezinár.**	**Tuzem.**
Podpis přednášejícího			15	7
		datum	26.9.2007	